Serial No. 09/912,129 Filed: 7/24/01

Mandich 9-10

Kanamari, Hiroo etal. ⑩日本国特許庁(JP) Sumitomo 識別記号

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-164740

⑤Int Cl.⁴

庁内整理番号

砂公開 平成1年(1989)6月28日

6-28-89

C 03 B 37/018 G 02 B 6/00

3 5 6

Z - 8821 - 4GA - 7036 - 2H

未請求 発明の数 1 (全7頁)

図発明の名称 光ファイバ用母材の製造方法

黒

21)特 願 昭62-322955

22出 願 昭62(1987)12月22日

@発 明 者 金 森

石

弘 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

79発 明 横浜製作所内

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

79発 明 浦 野 者

査

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

明 ⑫発 者 大 賀 裕

洋

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

個代 理 人 弁理士 内田 明 外3名

最終頁に続く

#### 明 細

# 1. 発明の名称

光ファイバ用母材の製造方法

# 2. 特許請求の範囲

- (1) 実質的に納粋な石英ガラスのコアを有する 光ファイパ用母材を作製するにあたり、コア 用の純石英ガラス酸粒子堆積体を加熱により 透明化する工程において、該堆積体を脱水・ 還元剤ガスを含む不活性ガス雰囲気下、温度 900~1100℃の範囲内で加熱すること により脱水・還元処理した後透明化すること を特徴とする光ファイバ用母材の製造方法。
- 脱水・還元剤ガスが CCe4 及び O2 からなり かつ両者のモル濃度比が 0.5 ≤ 0,/CCℓ4 < 1 の範囲内のものである特許請求の範囲第1項 記載の光ファイバ用コア母材の製造方法。
- (3) 脱水・還元剤ガスが CO 及び Cl<sub>2</sub> からなるも のである特許請求の範囲第1項記載の光ファ イバ用母材の製造方法。
- 脱水・還元剤ガスが SOCeってある特許請求

の範囲第1項記載の光ファイパ用母材の製造 方法。

- (5) 脱水・遺元剤ガスが S<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub> である特許請求 の範囲第1項記載の光ファイバ用母材の製造 方法。
- (6) 不活性ガスが He である特許請求の範囲第1 ないし弟 5 項のいずれかに記載される光ファ イバ用母材の製造方法。

### 3. 発明の詳細な説明

# [ 産業上の利用分野]

本発明は光ファイパ用母材の製造方法に関し 詳しくはコアが実質的に純粋な石英ガラスから **なる光ファイバのコア用母材の製造方法に関す** るものである。

# 〔従来の技術〕

コアが実質的に純粋な石英(SiO2) ガラスか らなる光ファイパは、コアにその屈折率を調整 するための弥加物(最も一般的には GeO2) を 含む光ファイパに比べ、森加物の存在に起因す る放射線或いは水気により誘起される伝送損失

(2)

の増加が少ないため、放射線環境下或いは水素が拡散侵入する危険のある環境下で使用しりる 光ファイバケーブル用として信頼性が高く 有用 である。さらに、放射線や水 業への 暴露のない 初期状態においてもコアに 旅加物を 含まないこ とによりレイリー 散乱を 低く抑える ことができ、 低損失な光ファイバを実現できる。

**;** ·

(3)

# 艮 1 純粋石英コア光フアイパの構造例

番号	ファイバの種類	クラッド	コア径	コア・クラッド間の屈折率差
1	シングルモードフアイバ	F - S102 ガラス	4 ~ 1 0 μm	0.5~08%
2	ステップインデックスフアイバ	F - SiO2 ガラス	50~100 #m	0.5 - 1.0 %
5	,	低屈折率樹脂	100~400µm	1.0 %以上

[発明が解決しようとする問題点]

j

従来、この種の光ファイバのコア部を合成する生産性に優れた手段としては、VAD法のようにガラス原科の火炎加水分解反応により SiO<sub>2</sub> ガラス酸 粒子の堆 微体を合成し、 然る後に加熱脱水処理及び加熱透明化する方法がある。

ところが、この種の方法で作製したコア用母材を用いた純粋石英(以下純 SiO2 とも称す)コア光ファイバにかいては波長 0.6 5 μm にかける吸収が大きくなるという問題が生ずる場合があった。この皮長は伝送用の光波長とは異なるが、0.6 5 μm にかける吸収はいわゆる非架構設案欠陥(Non Bridging Oxygen associated Hole Center:NBOHC と略す)の存在によると考えられてかり、この存在は光ファイバの耐水には重大な問題であった。

本発明はこのような欠陥量の少ないコア用母 材の作製方法を意図してなされたものである。

(5)

を脱水・遠元剤ガスを含む不活性ガス雰囲気下、 温度900~1100での範囲内で加熱することにより脱水・遠元処理した後透明化すること を特徴とする光ファイバ用母材の製造方法に関する。

本発明にかける脱水・遠元剤ガスとしては、 $CC\ell_4$  及び  $O_2$  からなるガス、 CO 及び  $O_2$  からなるガス、 CO 及び  $O_2$  からなるガス、  $SOC\ell_2$ ,  $S_2C\ell_2$  を用いることが特に好ましい。また  $CC\ell_4$  及び  $O_2$  からなるガスの場合は、両者のモル鰻度比が  $0.5 \le O_2/CC\ell_4 < 1$  の範囲内のものを用いる必要がある。また不活性ガスとしては Ho ガスを用いることが好ましい。

本発明においては、 $V \land D$  法その他の公知技術により作成したガラス酸粒子堆積体(スート体)を遺元性ガスと脱水剤ガスの共存雰囲気で  $9 \space 0 \space 0 \space -1 \space 1 \space 0 \space 0 \space 0$  温度範囲で加熱することにより該スート体を脱水処理する。この還元性ガスと脱水剤ガスの共存雰囲気とは、 $CC\ell_4$  と  $0_2$ ,  $CO \lor 0_2$ ,  $SOC\ell_2$  又は  $S_2C\ell_2$  のうちのいずれかと Ho, Ar 等の不估性ガス、 好ましくは Ho

[問題点を解决するための手段]

本発明者らはコア用母材作製方法について、研究を重ね、該欠陥量と、コア用ガラス酸粒子堆積体の加熱脱水処理時の雰囲気ガスの組成とに密接な関係があることを見出した。

即ち SiO2 ガラスを高級力で線引すると 0.6 5. μm に大きな吸収が発生する。 このメカニズムは未だ明確でないが、 有力な説として母材中の = Si-O-O-Si = という結合が切れ、 = Si-O という欠陥を作りこれが 0.6 5 μm 吸収となつつ という欠陥を作りこれが 0.6 5 μm 吸収となって 表れるという説がある。 そこで、 平発明者らはコア材中の = Si-O-O-Si = 結合を少なくするとはコア材 中の = Si-O-O-Si = 結合を少まくな で、 を明化 のに V A D 法でコア材( 純 SiO2 ガラス 像でに が ラス中の 酸素含 有遺を 減らすため 選した。することを考えつき、 本発明に到達した。

すなわち本発明は実質的に純粋な石英ガラス のコアを有する光ファイバ用母材を作製するに あたり、コア用の純石英ガラス酸粒子堆積体を 加熱により透明化する工程において、該堆積体

(6

からなる雰囲気である。  $CC\ell_4$  と  $O_2$  の場合は  $0.5 \le O_2/CC\ell_4$  く 1 の範囲内に両者の濃度を調整して行なうが、この理由は作用の項で説明する。

脱水処理に要する時間はスート体の大きさに 応じて適当に選択することができる。加熱手段 としては均熱炉、ソーン炉のいずれによつても よい。

以上の脱水処理の後に、該スート体を 1 6 0 0 で 程度の高温に加熱して透明化し、コア用透明 ガラス体(コア用母材)を得る。 このときの芽 囲気は脱水処理の祭の雰囲気と同じ或いは He 等不活性ガスのみの芽囲気でも差しつかえない。

第1図(A)に均無炉を用いる場合を示すが、炉心管22の内部にスート体25を収容しておき、はぶスート体の全長にわたる長さを持つヒータ部24により加熱する。雰囲気ガスは導入口28より供給され、流量計26、バルブ27を経て排出口29により排気される。21は支持権、25は炉である。

ソーン炉を用いる場合は、第1図(B)に示すように炉心管22に収容したスート体25を所定の速度で引き上げ又は引き下げて、短いヒータ部24を有する炉25を通過させることにより加熱する。雰囲気ガス導入と排出は第1図(A)の場合と问機である。

# (作用)

4.4

·· .

•

本発明の脱水工程における雰囲気ガスの作用を  $CC\ell_4$  と  $O_2$  からなる雰囲気の場合を例にして説明する。  $CC\ell_4$  と  $O_2$  を加熱炉に導入すると、

 $CC\ell_4$  +  $\pm$   $0_2$   $\rightarrow$  CO + 2  $C\ell_2$  ...... (1) 上記(1) 式のように還元剤となる CO ガスが発生する。このときの  $CC\ell_4$  と  $0_2$  との比率は、流量比で下記(2) 式の範囲内とすることが好ましい。

0.5 ≤ 0<sub>2</sub> / CCℓ<sub>4</sub> < 1 ..... (2)
0<sub>2</sub> / CCℓ<sub>4</sub> < 0.5 では下記(3)式のように反応して、
C (カーボン)が析出してスートに堆積してしまう。

(2+n)CCℓ<sub>4</sub> + 0<sub>2</sub> → 2 CO + 2(2+n)Cℓ<sub>2</sub>+n·C ···(3) 逆に 0<sub>2</sub> / CCℓ<sub>4</sub> > 1 では下記(4)式のように反応

(9)

得られたコア用純 Sio2 ガラス母材を電気抵抗炉で1900 でに加熱して10m がに延伸した。この母材を第2 図に示す構成の出発材1としてその外周部上に Sio2 のみからなる多孔質ガラス体2を形成した。 5 は合成用パーナである。この多孔質ガラス体部2 に表5 の条件で脱水、フツ素添加、透明化の加熱処理を施し透明ガラス化した。

表 3

条 件 処理工程			温度	<b>李囲気:流量</b>
岪	1	0	10500	Ce <sub>2</sub> : 600 cc/分 He : 158/分
岪	2	0	12500	SF <sub>6</sub> : 18/分
第	5	回	16000	SF6: 18/7

得られた透明ガラス体を電気抵抗炉にて再度
10季々に延伸し上配と同様の方法でスス付し、
再度表 5の条件で脱水遵元、フツ素添加、透明
化の各処理を行なつた。 得られた純石英コア・
フツ素添加クラッドからなる透明ガラス体を線

して、雰囲気中の02 が過多になつてしまう。

 $CC\ell_4 + (1+n)0_2 \rightarrow CO_2 + 2C\ell_2 + nO_2 \cdots (4)$  このように 脱水作用を有する  $C\ell_2$  ガスと、 選元作用のある CO ガスが共存する 芽囲気で 脱水・ 透明化することによつて、 ガラス中の酸素 含有量が 低波され 従来品よりも 線引 後の 欠陥量が 少ない 光ファイバが得られたと考えられる。

### 〔吳施朔〕

#### **吳施例**1

V A D 法により作製したコア用純 SiO<sub>2</sub> ガラス 酸粒子堆積体を第1 図(B)に示すようなソーン炉 で表2 の条件で、酸素流量×( cc / 分 )を植々 変えて加熱処理した。

授 2

条件 処理	温度	<b>雰囲気:硫量</b>
脱水遗元	10500	CC 2 2 0 0 00/97
		0 <sub>2</sub> : x cc/分
		He 108/分
透明化	1600℃	He 108/37

ă Că

速 1 0 0 m / 分、银力 1 0 8 で外径 1 2 5 μm のファイバに線引した。該ファイバの屈折率分布は第 5 図に示すものであつた。またそれぞれのファイバの 0.6 5 μm にかける吸収量 Δα と、コア脱水時の 02 流量 x (α/分) との関係を調べたところ、第 4 図に示すとかりであり、 ccl4 / 02が 1 を越えると、急激に Δα が増加することがわかる。なか、 0.6 5 μm にかける投収量 Δα ( dB/km ) は、第 5 図に示すよりに欠陥等のない純 SiO2 の場合の伝送損失 ロカる。

# 実施例 2

#### **奥施例** 3

実施例  $^1$  と同様に作製したコア用ガラス酸粒子堆積体の脱水・透明化を、 還元処理剤として「 $^{CC\ell_4}$  と  $^{O_2}$ 」の代わりに、  $^{CO}$  5  $^{O}$  0  $^{O}$   $^{O}$ 

#### 実施例 4

; -

٠, .

#### 比較例 1

比較例 2

03

# 4.図面の簡単な説明

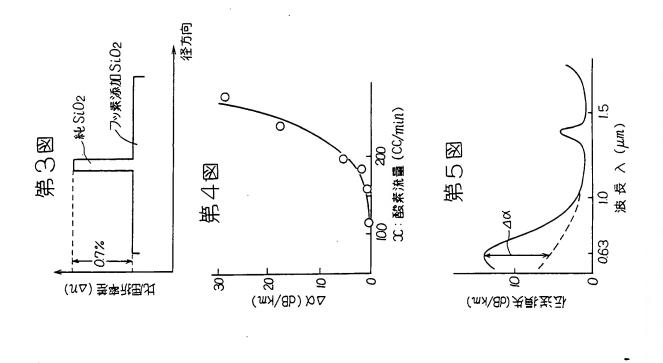
代理人 内田 明代理人 获原 克 一代理人 安 西 簿 夫代理人 平 石 利 子

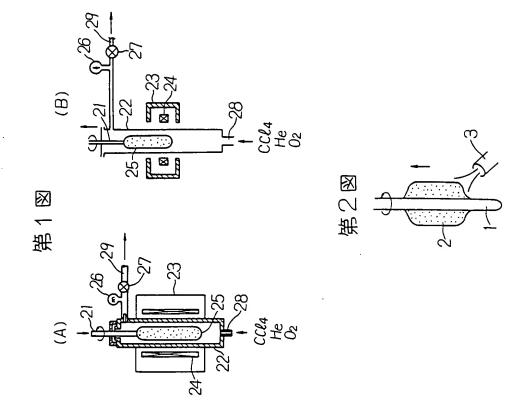
実施例 1 において、表 2 の「  $CC\ell_4$  と  $O_2$  」に 代えて、  $C\ell_2$  600  $\infty$  / 分と  $O_2$  600  $\infty$  / 分 とを用いて以外は同じにしてファイバを得た。 このものの  $\Delta\alpha$  は 60 dB / 畑と非常に高かつた。

以上のように本発明による還元・脱水処理を行つたって用母材を用いた実施例1~4の以口ではいずれも0.6 5 μm における吸収によるは、なののは2 / He 雰囲気による比較例1は0.6 5 μm における吸収が異常に高いたの脱水処理をした比較例の方法が欠陥量の少ない光ファイバ用母材を製造できるととは明らかである。 [発明の効果]

本発明はコア用の純 S102 ガラス酸 粒子 堆積体を遺元性労 囲気で加熱して脱水処理するので、ガラス中の酸素量が減り、 0.6 5 μm における吸収を少なくできるという利点がある。 その結果、本発明は耐水素特性に優れた信頼性のある。 光ファイバ用母材を製造できる。

04





第1頁の続き

⑫発 明 者 田 中 豪 太 郎 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内